

yelo

老化测试系统 小功率半导体激光器 Y4000



系统简介

您可以使用Yelo的Y4000标准化系统轻松完成各种小功率半导体激光器器件的可靠性测试及老化。通过这一流程您可快速高效地筛选出失效器件避免其流入下道工序乃至客户手中。Y4000系统自带的软件可以自动处理各种测试数据并计算阈值，其灵活的可扩展性和友好的人机界面也将显著提高用户的工作效率。

Y4000是面向特大规模量产级别老化测试的理想选择。其适用于QFSE, SPF+, 400G及800G等网络应用器件，并可实现老化过程中对LIV等重要特性值的在线监测及预警。

保护您的产品

Yelo的Y4000系统集成了以下功能以保护待测产品。

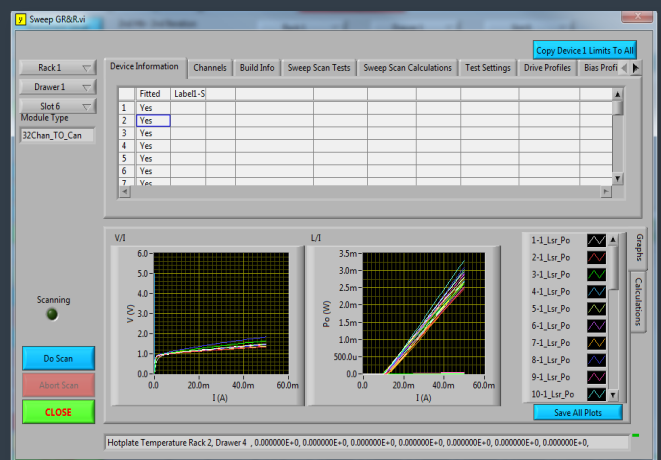
- 可编程的电流开启及关闭方式用于降低热冲击
- 过电流保护回路
- 温度异常保护
- 电网失效时的自动安全关机

老化控制软件

右图即Yelo老化控制软件内某次32个TOcan激光器器件老化完成后系统自动生成的图形化数据报告。

左侧图表: 随电流升高器件电压值的变化趋势。
蓝色曲线表示该器件电压测试结果常时为5V，即开路。

右侧图表: LIV特性曲线，未失效器件均从大约10mA起有光功率输出，阈值数据的计算由控制软件自动完成。



操作人员的安全防护

Yelo在设计与生产环节自始至终秉承安全第一的原则，以下功能将确保操作人员的健康与安全。

- 安全联锁装置杜绝因误操作引起的非计划启动
- 人员安全与健康防护
- CE标准兼容

适用器件类型

- ✓ 半导体激光器
- ✓ APD
- ✓ 集成器件
- ✓ 光电二极管



Y4000

系统功能 & 架构

系统主要功能一览

- 可测试TOcan, COS, COC, 蝶形, VCSEL, PID等各种定制化器件
- 适用于100G, 400G及800G网络级别SFP, SFP+收发器件
- 单台通道数384至最大5120
- 可适用于单通道至高2000mA的小功率器件
- 器件的加速老化及可靠性验证
- 为用户定制化的NIST系统

架构



模块化夹具



抽屉



机柜

基本规格

机柜类型	42U
机柜尺寸	800mm (W) x 900mm (D) x 2100mm (H)* * 三色灯除外
控温范围	20 - 90°C
控温方式	TEC/水冷
最大驱动电流	单通道2000mA
最大通道数	384 至 5120* * 取决于电流配置方式